

# MODELO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN LA ORGANIZACIÓN PLAN TÁCTICO DE LA CALIDAD (ITIL & ISO 20000)

YURLEY CONSTANZA MEDINA CÁRDENAS  
YESENIA ARENIZ AREVALO  
DEWAR WILLMER RICO BAUTISTA



Medina Cárdenas, Yurley Constanza

Modelo estratégico para la gestión tecnológica en la organización: plan táctico de la calidad (ITIL & ISO 20000 / Yurley Constanza Medina Cárdenas, Yesenia Areniz Arévalo, Dewar Willmer Rico Bautista – 1a. ed. – Medellín : Instituto Tecnológico Metropolitano, 2016.  
90 p. – (Investigación científica)

Incluye referencias bibliográficas  
ISBN 978-958-5414-00-6

1. Gestión tecnológica 2. Gestión de servicios de tecnologías de la información 3. ISO 20000 I. Areniz Arévalo, Yesenia II. Rico Bautista, Dewar Willmer III. Tit. IIV Serie

658.406 3 SCDD 21 ed.

Catalogación en la publicación - Biblioteca ITM

MODELO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN LA ORGANIZACIÓN  
PLAN TÁCTICO DE LA CALIDAD (ITIL & ISO 20000)

Primera edición: diciembre de 2016

Publicación electrónica para consulta gratuita

©Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM–

©Universidad Francisco de Paula Santander – Ocafia

#### AUTORES

Yurley Constanza Medina Cardenas / Yesenia Areniz Arévalo / Dewar Wilmer Rico Bautista

#### RECTORA

María Victoria Mejía Orozco

#### DIRECTORA EDITORIAL

Silvia Inés Jiménez Gómez

#### COMITÉ EDITORIAL

Eduard Emiro Rodríguez Ramírez, MSc.

Jaine Andrés Cano Salazar, PhD.

Silvia Inés Jiménez Gómez, MSc.

Yudy Elena Giraldo Pérez, MSc.

Viviana Díaz, Esp.

#### CORRECCIÓN DE ESTILO

Lila M. Cortés Fonnegra

#### ASISTENTE EDITORIAL

Viviana Díaz

#### DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Alfonso Tobón Botero

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

Calle 73 No. 76A 354

Tel.: 4405197

<http://fondoeditorial.itm.edu.co/>

[www.itm.edu.co](http://www.itm.edu.co)

Medellín – Colombia

Las opiniones originales y citas del texto son de la responsabilidad de los autores. El ITM salva cualquier obligación derivada del libro que se publica. Por lo tanto, ella recaerá única y exclusivamente sobre los autores.